

1. Спосіб виявлення змін поверхневих властивостей високотемпературних надпровідників, який включає в себе безконтактне вимірювання діаманітного відгуку зразка, що знаходиться у надпровідному стані, за допомогою вимірювального датчика, який **відрізняється** тим, що в процесі обробки на поверхні зразка формується область „свідка” анізотропної форми з незмінними властивостями і досліджується зміна параметра діаманітного відгуку A в залежності від кута φ між віссю анізотропії „свідка” та напрямком зовнішнього сталого магнітного поля, яке прикладається в площині поверхні, що досліджується, і його значення не перебільшує величини першого критичного поля H_{c1} для даного матеріалу.

2. Спосіб за п. 1 **відрізняється** тим, що виявлення змін властивостей, які відбулися під час обробки, здійснюється за наявності немонотонної кутової залежності параметра відгуку $A(\varphi)$ за умовою $\Delta A(\varphi) > \Delta A(0)$, де ΔA - розмах анізотропії, а ΔA_0 - поріг вимірювальної системи.